

# $\mu$ -XPS: 走査型マイクロX線光電子分光装置 (Scanning Microprobe X-ray Photoelectron Spectroscopy)

## 特長

- ・微小領域の分析
- ・優れた帯電中和機構
- ・デプスプロファイル

イオン銃: ArおよびC60(有機物の損傷少)

- ・多彩な表現

ライン分析

マッピング分析(化学状態マッピング)

角度分解測定

検出限界	1 ~ 0.1 at %
検出深さ	数 nm
最小X線径	10 $\mu$ m

## 構成



(PHI Quantera SXM)